•	Search	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	er
10/717,895	MATSUO ET AL.	
Examiner	Art Unit	
David Mis	2817	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
331	36C,	5/17/2005	DM
	74-77,		
	96,		
	117R,		
. =.	117FE,		
	117D,		
	171,		
	177V		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	l		

SEARCH NO (INCLUDING SEARC	H STRATEG	Y)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR
·	<del></del>	
	•	
-		
·	•	